Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/562,846	RATERMANN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Yuwen Pan	2618	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
455	41.3,41.2, 41.1,507,5 09,512	4/25/2007	ΥP	
370	449,455			
update s	eursh	4168	TP	
		•		
	·			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
-			
De pa listory	enh	2/6/08	m

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATE	EXMR
EAST	4/25/2007	ΥP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		-
,		
· .		